## Оптические свойства монокристаллов $Cd_{1-x}Zn_xTe$ (0 < x < 0.1) в инфракрасном диапазоне длин волн

© А.И. Белогорохов<sup>¶</sup>, В.М. Лакеенков, Л.И. Белогорохова\*

Федеральное государственное унитарное предприятие, Научный центр "Гиредмет", 109017 Москва, Россия

\* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119899 Москва, Россия

(Получена 15 ноября 2000 г. Принята к печати 27 ноября 2000 г.)

Методами длинноволновой оптической спектроскопии исследовались дисперсионные зависимости коэффициента пропускания  $T(\omega)$  монокристаллов  $Cd_{1-x}Zn_xTe$  (0 < x < 0.1), выращенных с помощью модифицированного метода Бриджмена, в интервале температур 5–300 К. В неотожженных образцах, имеющих *p*-тип проводимости, наблюдалось резкое увеличение поглощения в области энергий, меньших ширины запрещенной зоны. Более того, при изменении температуры образца от 5 до 300 К зависимости  $T(\omega)$ пересекаются практически на одной и той же длине волны. Рассчитаны теоретические дисперсионные зависимости  $T(\omega)$  с учетом существенного вклада механизма межподзонного перехода носителей заряда в валентной зоне. Проведена оценка положения уровня Ферми в исследованных образцах при T = 77.3и 295 К. При x = 0.040 - 0.047 наблюдается немонотонная зависимость положения уровня Ферми от состава. Обсуждается вопрос о возможном влиянии преципитатов теллура на уменьшение коэффициента пропускания света в  $Cd_{1-x}Zn_xTe$  в области волновых чисел  $3000 - 400 \text{ см}^{-1}$ .

#### Введение

Полупроводниковые твердые растворы Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Te представляют собой перспективный материал для создания разнообразных оптоэлектронных и тепловизионных приборов [1]. Они широко используются в качестве материала подложки при выращивании эпитаксиальных структур  $Cd_xHg_{1-x}$  Te, на основе которых уже созданы матричные инфракрасные фотоприемники, работающие в спектральном диапазоне 3-5 и 8-14 мкм [2]. Твердые растворы Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Te весьма перспективны для создания на их основе высокоэффективных детекторов большой площади для регистрации гамма-излучения [3], что обусловлено большими значениями ширины запрещенной зоны и атомного номера цинка, а также имеющейся возможностью получать материал с удельным сопротивлением  $\rho \approx 10^{10} \, \mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$ . Наметившиеся тенденции в создании матричных инфракрасных фотоприемников и гамма-детекторов, имеющих большую площадь, диктуют жесткие требования к контролю свойств твердого раствора  $Cd_{1-r}Zn_rTe$ , а также к локальной однородности материала. Вопрос об изменении оптических свойств материала с составом и концентрацией носителей заряда в спектральной области межзонных переходов рассмотрен авторами работ [4,5]. В частности, в работе [5] обнаружено, что поведение коэффициента поглощения в этом диапазоне длин волн подчиняется экспоненциальному закону (правило Урбаха). Спектры пропускания Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Te за краем фундаментального поглощения представлены в работе [6]. В ней проведено исследование изменения весового соотношения компонентов твердого раствора с температурой (термограммы), что позволило ее авторам связать увеличение поглошения в лиапазоне волновых чисел 700-4000 см<sup>-1</sup> с присутствием в объеме материала преципитатов теллура. Полученные результаты представляют значительный интерес, так как многих исследователей интересуют причины изменения оптических свойств  $Cd_{1-x}Zn_x$  Те в этом спектральном интервале [7]. Это в свою очередь обусловлено тем, что, как отмечалось выше, данный твердый раствор часто используется в качестве подложки для выращивания эпитаксиальных структур  $Cd_xHg_{1-x}$ Те и создания на их основе приборов для инфракрасной (ИК) области спектра, работающих именно в этом диапазоне. Обозначенная выше причина явилась движущим стимулом проведения цикла работ, направленных на исследование взаимосвязи легирования  $Cd_{1-x}Zn_xTe$  и его оптических свойств [8]. Несмотря на ряд появившихся публикаций, однозначного ответа на вопрос о причине уменьшения поглощения квантов света в области волновых чисел 3000-400 см<sup>-1</sup> еще нет.

### Экспериментальные результаты и их обсуждение

 $Cd_{1-r}Zn_rTe$ Монокристаллические образцы (0 < x < 0.18) имели *p*-тип проводимости, выращивались по методу Бриджмена, имели удельное сопротивление при комнатной температуре ( $T = 300 \, {\rm K}$ ) от 0.5 до 2.5 · 10<sup>2</sup> Ом см и подвижность дырок  $40-100 \,\mathrm{сm}^2 \,\mathrm{B}^{-1} \cdot \mathrm{c}^{-1}$ . Концентрация носителей заряда (КНЗ) при  $T = 300 \,\mathrm{K}$  составляла  $10^{15} - 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}$ . Из кристаллов вырезали монокристаллические пластины, ориентированные по кристаллографической плоскости (111). Состав образцов контролировался методами рентгеновского энергодисперсионного анализа, лазерной масс-спектрометрии и по краю межзонного поглощения. Измерение значений параметров кристаллической решетки образцов проводилось методами рентгеновской

<sup>¶</sup> E-mail: belog@mig.phys.msu.su

Fax: +7-(095)4387664



**Рис. 1.** Экспериментальные (штриховые кривые) и расчетные (сплошные кривые) спектры пропускания образца  $Cd_{0.948}Zn_{0.052}$  Te.



**Рис. 2.** Экспериментальные (штриховые кривые) и расчетные (сплошные кривые) спектры пропускания образца Cd<sub>0.956</sub>Zn<sub>0.044</sub>Te.

дифрактометрии высокого разрешения. Поверхность образцов перед измерениями подвергалась химикомеханической полировке с последующим травлением в растворе Br<sub>2</sub>/CH<sub>3</sub>OH.

Оптические спектры пропускания света  $T(\omega)$  при температурах T = 5-300 К были получены на фурье-спектрометре IFS-113v (Bruker, Germany) в диапазоне волновых чисел 10-5000 см<sup>-1</sup> со спектральным разрешением не хуже 1 см<sup>-1</sup>. Спектральные зависимости пропускания  $T(\omega)$  исследованных образцов в ИК диапазоне длин волн проявляли различный характер своего поведения (рис. 1, 2). Так, образцы с низкой КНЗ имели коэффициент пропускания квантов света на уровне 60-63% в исследованном диапазоне длин волн вплоть до частот,

при которых начинают сказываться эффекты многофононного поглощения света. Образцы же с большей концентрацией носителей заряда, особенно если ситуация близка к вырождению дырочного газа, имеют сильное поглощение в полосе частот  $\omega = 3000 - 400 \,\mathrm{cm}^{-1}$ . Обращает на себя внимание изменение характера поведения зависимостей  $T(\omega)$  с понижением температуры: они имеют точку пересечения с зависимостью при более высокой температуре, причем в зависимости от степени вырождения дырочного газа точка пересечения спектров смещается вправо или влево по шкале энергий. Подобные зависимости коэффициента поглощения от длины волны  $\alpha(\omega)$  в широком температурном интервале наблюдались в кристаллах CdTe [9], и это можно объяснить проявлением резонансного характера поведения диэлектрической проницаемости  $\varepsilon(\omega)$ , обусловленного переходами носителей заряда между ветвями легких и тяжелых дырок. Для этого воспользуемся приведенным в работе [9] соотношением для коэффициента поглощения, связанного с переходами между ветвями легких и тяжелых дырок, который без учета влияния гофрированности потолка валентной зоны имеет следующий вид:

$$\alpha_{12}(\omega) = \frac{e^2 \omega^{1/2}}{nc\hbar^{3/2} \left(\frac{1}{2m_2} - \frac{1}{2m_1}\right)} \\ \times \left\{ \left[ \exp\left(\frac{\hbar\omega\rho}{kT(1-\rho)} - \frac{E_{\rm F}}{kT}\right) + 1 \right]^{-1} - \left[ \exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT(1-\rho)} - \frac{E_{\rm F}}{kT}\right) + 1 \right]^{-1} \right\}.$$
(1)

Здесь k — постоянная Больцмана,  $\rho = m_2/m_1$ ,  $m_1$ и  $m_2$  — масса тяжелых и легких дырок соответственно, n — показатель преломления, c — скорость света,  $E_{\rm F}$  — энергетическое положение уровня Ферми, изменение которого с понижением температуры аппроксимировалось следующим образом:

$$E_{\rm F}(T) = E_{\rm F}(0) \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{kT}{E_{\rm F}(0)} \right)^2 \right].$$
 (2)

Учет гофрировки валентной зоны приводит к существенному изменению формы частотной зависимости Im  $\varepsilon(\omega)$ , в частности к сильному размытию высокочастотного края полосы поглощения, но, как показано в [9], лишь при низких (4 < T < 15 K) температурах. В данном случае не имело смысла принимать во внимание подобную поправку.

На рис. 1 и 2 показаны как экспериментальные, так и рассчитанные согласно подходу, изложенному выше, оптические спектры двух образцов  $Cd_{1-x}Zn_xTe$  различного состава. Из них видно, что удалось получить удовлетворительное согласие между экспериментальными и теоретическими данными, что в свою очередь позволяет судить о применимости использованной модели. Некоторое рассогласование, наблюдавшееся со стороны меньших энергий, объясняется проявлением многофононного



**Рис. 3.** Экспериментальные спектры пропускания кристаллов  $Cd_{1-x}Zn_xTe$  различного состава при T = 78 и 295 К. Значения *х*: 1 - 0.041, 2 - 0.044, 3 - 0.046, 4 - 0.031.

поглощения, которое не учитывалось при моделировании спектров  $T(\omega)$ . Характерная точка пересечения спектральных зависимостей для каждого образца своя, что хорошо видно из рис. 3. Это естественно, потому что они различаются по значениям концентрации и подвижности носителей заряда. Зная положение этой точки в спектрах, можно в свою очередь определить и энергетическое положение уровня Ферми в исследуемом материале CdZnTe. Результаты расчета, выполненные для серии образцов состава x = 0 - 0.06 при комнатной температуре и температуре жидкого азота, показаны на рис. 4 и 5. Как можно видеть из приведенных рисунков, наблюдается монотонная зависимость положения уровня Ферми  $E_{\rm F}$  в образцах  ${\rm Cd}_{1-x}{\rm Zn}_x{\rm Te}$  от их состава xвплоть до значений x = 0.04. Далее явно выделяется область составов  $x \approx 0.04 - 0.05$ , где наблюдаются сильные отклонения от монотонного характера указанных выше зависимостей, причем их проявление подобно друг другу для двух различных температур. В работе [10] в свое время сообщалось о том, что значения частот оптических фононов в образцах Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Te в этом же диапазоне составов отличались от теоретических значений, полученных в рамках модели однородных ячеечных смещений. На основании полученных в данной работе и приведенных авторами [10] результатов можно предположить, что для материала Cd<sub>1-x</sub>Zn<sub>x</sub>Te в области составов  $x \approx 0.04 - 0.05$  имеют место эффекты изменения локальной динамики кристаллической решетки, которые оказывают существенное влияние на систему носителей заряда, в данном случае дырок. Подобные эффекты должны проявляться в непосредственной близости от окрестности вакансии кадмия, когда ближайшие атомы теллура оказываются смещенными из своих центральных положений. При этом, чтобы уравновесить изменение поляризуемости решетки в этой области кристалла, здесь

должна локализоваться дырка. В результате получается комплекс типа  $Te-p^+$ -Te. В неотожженных кристаллах может происходить локальная самоорганизация центров  $Te-p^+$ -Te в размерные образования (2D или 3D), масштаб которых составляет от десятков нм до долей мкм. В рамках настоящей работы нет возможности дать точную оценку размеров подобных образований. Проведенное селективное травление пластин CdZnTe, состоящих из двойниковых кристаллов, показало, что в той части образца, в которой наблюдается уменьшение коэффициента поглощения в области волновых чисел 3000-400 см<sup>-1</sup>, появляются характерные ямки травления. Авторы работы [6] провели исследования по влиянию теллуровых включений в материале CdZnTe на характер пропускания ими света в ИК области длин волн. Было замечено, что в образцах CdZnTe, в которых концентрация теллуровых преципитатов достигала 0.6 вес%,



**Рис. 4.** Зависимости уровня Ферми  $E_{\rm F}$  от состава твердого раствора  ${\rm Cd}_{1-x}{\rm Zn}_x{\rm Te}$ , рассчитанная для  $T=78\,{\rm K}.$ 



**Рис. 5.** То же, что и на рис. 4, но для T = 300 K.

уровень пропускания света в ИК диапазоне длин волн не превышал 55%, а сам характер поведения спектральных зависимостей  $T(\omega)$  был аналогичен тем, которые приведены на рис. 1 и 2. В нашем случае в кристаллах CdZnTe после проведения дополнительного отжига в парах кадмия при температурах  $T > 480^{\circ}$ C пропускание ими света в диапазоне  $3000-400 \text{ см}^{-1}$  увеличивалось. В субмиллиметровой области волновых чисел, за полосой поглощения на колебаниях кристаллической решетки ( $\omega < 80 \text{ см}^{-1}$ ), значение  $T(\omega)$  в исследованных образцах вновь увеличивалось до  $\sim 40-50\%$ . Это свидетельствует об отсутствии поглощения квантов света на мелких примесных уровнях в запрещенной зоне рассматриваемых кристаллов CdZnTe.

#### Заключение

На основании всего сказанного можно сделать вывод о существенном влиянии теллуровых включений на увеличение поглощения квантов света со стороны энергий, меньших ширины запрещенной зоны CdZnTe. Немонотонная зависимось  $E_F(x)$  при x = 0.04-0.05связана скорее всего с отклонениями от стехиометрии при получении материала указанного состава.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 00-02-17104).

#### Список литературы

- E.A. Paten, M.H. Kalisher, G.R. Chapman, J.M. Fulton, C.Y. Huang, P.R. Norton, M. Ray, S. Sen. J. Vac. Sci. Technol., B9, 1746 (1991).
- [2] S.M. Johnson, M.H. Kalisher, W.L. Ahlgren, J.B. James, C.A. Cockrum. Appl. Phys. Lett., 56, 946 (1990).
- [3] P. Fougeres, M. Hage-Ali, J.M. Koebel, P. Siffert, S. Hassan, A. Lusson, R. Triboulet, G. Marrakchi, A. Zerrai, K. Cherkaoui, R. Adhiri, G. Bremond, O. Kaitasov, M.O. Ruault, J. Crestou. J. Cryst. Growth, **184/185**, 1313 (1998).
- [4] D. Ohimann, M. Mazilu, R. Levy, B. Honerlage. J. Appl. Phys., 82, 1355 (1997).
- [5] A.J. Syllaios, P.-K. Liao, B.J. Greene, H.F. Schaake, H.-Y. Liu, G. Westphal. J. Electron. Mater., 26, 567 (1997).
- [6] J. Zhu, X. Zhang, B. Li, J. Chu. Infr. Phys. Techn., 40, 411 (1999).
- [7] А.Р. Гареева, В.И. Петров, Н.А. Смирнова, В.М. Лакеенков,
  А.Г. Белов, А.И. Белогорохов, Н.В. Пашкова. *Матер.* VIII Всес. симп. по полупроводникам с узкой запрещенной зоной и полуметаллам (Львов, Украина, 1991)
   т. 2, с. 148.
- [8] Н.В. Агринская, В.В. Шашкова. ФТП, 24, 697 (1990).
- [9] А.И. Белогорохов. ФТТ, 34, 1045 (1991).
- [10] A.I. Belogorokhov, L.I. Belogorokhova, A.G. Belov, V.M. Lakeenkov, L.M. Liberant, N.A. Smirnova. J. Cryst. Growth, 159, 186 (1996).

Редактор Т.А. Полянская

# Optical properties of $Cd_{1-x}Zn_xTe$ single crystal (0 < x < 0.1) in a far-infrared spectral region

A.I. Belogorokhov, V.M. Lakeenkov, L.I. Belogorokhova\*

Institute of Rare Metals, 109017 Moscow, Russia \* Moscow State University, 119899 Moscow, Russia

**Abstract** Infrared (*IR*) transmittance  $T(\omega)$  of  $Cd_{1-r}Zn_rTe$ (0 < x < 0.1) single crystals grown by a modified Bridgman technique has been investigated within the temperature range 5-300 K. As-grown CdZnTe crystals of p-type conductivity exhibited strong absorption in the wavelength region below the band gap energy. The spectral dependencies of  $T(\omega)$  that had been measured at different temperatures (in the range from 5 to 300 K) intersected at the same wavelength. The dispersion relations of  $T(\omega)$  have been calculated taking into account an essential role of intersubband transitions of carriers in the valence band. Estimation of energy position of Fermi level in the samples at T = 77.3 K and 295 K In the samples with x = 0.040 - 0.047, has been made. a nonmonotonous dependence of Fermi level position on Zn concentration is observed. The effect of the Te precipitation in  $Cd_{1-r}Zn_rTe$  crystal on decreasing *IR* transmittance from 3000 to  $400 \,\mathrm{cm}^{-1}$  is under discussion.